

智慧財產及商業法院行政判決

113年度行專訴字第2號

民國113年10月16日辯論終結

原告 費西產品設計研發有限公司

代表人 陳冠名

訴訟代理人 林冠佑律師

張尚宸律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 劉聖尉

參加人 黃秀媛

上列當事人間發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國112年11月6日經法字第11217307620號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人參加訴訟，判決如下：

主 文

一、訴願決定及原處分關於「請求項1至13舉發不成立」部分均撤銷。

二、被告就發明第I630405號「雷射干擾器」專利舉發事件（案號：106112442N01）應作成「請求項1至13舉發成立，應予撤銷」之審定。

三、訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

甲、程序方面

參加人經合法通知（卷二第33頁），無正當理由於言詞辯論期日未到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，依行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，准原告及被告聲請，由到場之當事人辯論而為判決（卷二第59頁）。

乙、實體方面

壹、爭訟概要：

參加人於民國106年4月13日以「雷射干擾器」申請發明專利，經被告編為第106112442號審查，准予專利，並發給發明第I630405號專利證書（下稱系爭專利，申請專利範圍共10項）。110年4月9日原告以系爭專利違反核准時專利法第22條第1項第1款及第2項規定提起舉發；參加人旋於同年7月9日提出系爭專利更正本（更正後申請專利範圍共13項）。案經被告審查，以112年4月14日（112）智專三(二)04181字第11220344890號專利舉發審定書為「110年7月9日之更正事項，准予更正」、「請求項1至13舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服前揭舉發不成立部分提起訴願，經濟部於112年11月6日以經法字第11217307620號訴願決定書（下稱訴願決定）予以駁回，原告不服提起本訴。本院認為本件判決結果將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟（卷一第331至332頁）。

貳、原告主張及聲明：

一、系爭專利之基礎原理來自先前西元1989年已存在之雷射測速技術，及針對雷射測速技術所相應而生之測速對策裝置。依系爭專利請求項1之解釋結果，系爭專利係以間斷地發射複數干擾脈波，使「重疊」於入射脈波（雷射偵測器反射之入射脈波）為技術手段，其中所謂重疊之意義，係在雷射偵測器接收脈波之「同一時域上」發生重疊。又系爭專利請求項1之技術特徵已為甲證2第[0026]、[0049]、[0050]段或甲證4第[0039]、[0057]、[0059]、[0101]段所揭露而不具新穎性，亦為甲證2及甲證4組合所示前揭段落內容所揭露而不具進步性。而系爭專利請求項3之技術特徵為甲證2第[0050]段、甲證4第[0057]、[0059]段及甲證6第9頁第2行、圖1內容所揭露。被告雖將「部分重疊」、「完全重疊」視為系爭專利請求項1、3之技術特徵，然系爭專利說明書第[0011]段之說明，可知系爭專利最終目的是在追求「干擾脈波與入射脈波每次都能完全重疊，以達到完全阻斷之效」，無論是干擾脈波重疊於入射脈波1/2或3/4以上之重疊程度差異，都只

01 是在追求完全重疊過程中的必然現象，並非為達特定目的而
02 實施之技術特徵。甲證2第[0050]段「in phase with」之用
03 語，已揭露系爭專利請求項1干擾脈波「重疊、重和、疊加
04 地」於入射脈波之技術特徵。系爭專利請求項得由爭點所示
05 證據組合證明不具進步性，系爭專利並未合乎取得申請發明
06 專利之要件，應當撤銷。

07 二、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告就系爭專利應為舉發
08 成立撤銷專利權之審定。

09 參、被告答辯及聲明：

10 一、原處分已載明原告所提證據組合不足以證明系爭專利不具進
11 步性之理由，其中甲證2之發明目的係要達成改善產生干擾
12 脈波的硬體電路，與系爭專利發明目的不同，並未揭露或教
13 示入射脈波與干擾脈波得以部分重疊，原告以系爭專利兩脈
14 波僅部分重疊能由證據2輕易推導完成，恐有後見之明疑
15 慮。又甲證4並未明確揭露干擾與入射脈波可以重疊之技術
16 特徵，所屬技術領域中具有通常知識者無動機將甲證4技術
17 內容簡單修飾而完成系爭專利之發明。而關於系爭專利請求
18 項1所載「該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間
19 隔時間內發射、且各持續至重疊於其中一該入射脈波」之解
20 釋方式，「持續至重疊」一語除可解釋包含系爭專利圖6之
21 干擾與入射脈波為「部分重疊」之情況外，亦可解釋為包含
22 兩脈波為「完全重疊」之情況。

23 二、聲明：駁回原告之訴。

24 肆、參加人經合法通知未於準備程序及言詞辯論期日到場，惟提
25 出書狀陳稱：系爭專利請求項1界定「該複數干擾脈波間斷
26 地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射、且各持續至重疊
27 於其中一該入射脈波」之技術特徵，未被任一證據所揭露，
28 尤其是「干擾脈波間斷地於入射脈波之間隔時間內發射」之
29 技術特徵，與證據所揭露in phase with之「脈波完全重
30 疊」而不會有「干擾脈波提前於入射脈波發射」至「部分重

01 疊」的現象，系爭專利具專利要件而未違反核准時專利法之
02 規定。原告之訴無理由，應予駁回等語。

03 伍、爭點（卷二第18至19頁）：

04 一、系爭專利請求項1有關「複數干擾脈波……各持續至重疊於
05 其中一該入射脈波」技術特徵之解釋？

06 二、甲證2或甲證4是否足以證明系爭專利請求項1不具新穎性？

07 三、甲證2及4之組合是否足以證明系爭專利請求項1、6不具進步
08 性？

09 四、甲證2、4及6之組合是否足以證明系爭專利請求項2至5、11
10 至13不具進步性？

11 五、甲證1、2及4之組合是否足以證明系爭專利請求項7不具進步
12 性？

13 六、甲證1、2、4及6之組合是否足以證明系爭專利請求項8至10
14 不具進步性？

15 陸、本院判斷：

16 一、系爭專利申請日為106年4月13日（審定卷第19頁），於107
17 年3月26日經審定准予專利，是系爭專利有無撤銷原因，應
18 以核准審定時之106年1月18日修正公布、同年5月1日施行之
19 專利法（下稱核准時專利法）為斷。而核准時專利法第22條
20 第1項第1款及第2項規定：「（第1項）可供產業上利用之發
21 明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：□申請
22 前已見於刊物者。……（第2項）發明雖無前項各款所列情
23 事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前
24 技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」。再依同法第
25 71條第1項第1款規定，發明有違反第22條規定之情事，任何
26 人得附具證據，向專利專責機關舉發之。準此，系爭專利有
27 無違反核准時專利法第22條第1項第1款及第2項規定情事，
28 依法應由舉發人即原告附具證據證明之。

29 二、系爭專利技術分析：

30 （一）系爭專利技術內容

01 系爭專利係關於一種雷射干擾器，包括：一光接收器，供接
02 收一包括複數入射脈波之入射雷射光並產生一與該複數入射
03 脈波相關聯之入射光訊號；一光發射器；一處理單元，依據
04 該入射光訊號計算該複數入射脈波之相鄰二者之間的間隔時
05 間、且驅動該光發射器產生一干擾雷射光，該干擾雷射光包
06 括複數干擾脈波，該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈
07 波之間隔時間內發射、且各持續至重疊於其中一該入射脈波
08 （系爭專利摘要，卷一第441頁）。

09 (二)系爭專利申請專利範圍（系爭專利圖式如附件一所示）

10 系爭專利核准公告之請求項共10項，其中請求項1為獨立
11 項，其餘為附屬項。專利權人即參加人於110年7月9日提出
12 說明書及申請專利範圍更正本，經被告審定准予更正（更正
13 後請求項共13項，以下請求項均指更正後內容），各請求項
14 內容如下：

- 15 1.請求項1：一種雷射干擾器，包括：一光接收器，供接收一
16 包括複數入射脈波之入射雷射光並產生一與該複數入射脈波
17 相關聯之入射光訊號；一光發射器；一處理單元，依據該入
18 射光訊號計算該複數入射脈波之相鄰二者之間的間隔時間、
19 且驅動該光發射器產生一干擾雷射光，該干擾雷射光包括複
20 數干擾脈波，該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之
21 間隔時間內發射、且各持續至重疊於其中一該入射脈波。
- 22 2.請求項2：如請求項1所述的雷射干擾器，其中該干擾脈波之
23 振幅大於該入射脈波之振幅，該光接收器連接於一電路板，
24 該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收器。
- 25 3.請求項3：如請求項1所述的雷射干擾器，其中各該干擾脈波
26 持續至重疊於其中一該入射脈波之1/2以上，該光接收器連
27 接於一電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮
28 罩該光接收器。
- 29 4.請求項4：如請求項1所述的雷射干擾器，其中該干擾雷射光
30 之發射訊號頻率與該入射雷射光之發射訊號頻率相同，該光

01 接收器連接於一電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該
02 金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電路。

03 5.請求項5：如請求項1所述的雷射干擾器，其中該複數入射脈
04 波之數量至少為3個，該光接收器及該光發射器連接於一電
05 路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接
06 收器；該金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電
07 路，該濾波透鏡設於一外殼，該光接收器及該光發射器設於
08 該外殼中。

09 6.請求項6：如請求項1所述的雷射干擾器，其中該處理單元包
10 括一與該光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級放大
11 器通聯之第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理
12 器，該處理器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器
13 處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號
14 間隔時間、且驅動該光發射器產生該干擾雷射光。

15 7.請求項7：如請求項6所述的雷射干擾器，其中該第一級放大
16 器為電晶體放大器，該第二級放大器為視頻放大器，該處理
17 單元另包括一通聯於該視頻放大器與該處理器之間的比較
18 器，該比較器設有一閾值，該比較器僅允許經該視頻放大器
19 處理後之放大訊號大於該閾值的峰部部分通過，該等峰部部
20 分中之相鄰二者之間間隔該間隔時間。

21 8.請求項8：如請求項7所述的雷射干擾器，其中該閾值設為該
22 放大訊號之電壓值、電流值或振幅值，該光接收器連接於一
23 電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光
24 接收器，該金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電
25 路。

26 9.請求項9：如請求項1所述的雷射干擾器，其中於該光接收器
27 之前方另設有一濾波透鏡，該濾波透鏡僅允許700奈米至950
28 奈米波長的光通過，該濾波透鏡設於一外殼，該光接收器及
29 該光發射器設於該外殼中。

30 10.請求項10：如請求項8所述的雷射干擾器，其中該光接收器
31 包括至少一光電二極體，該光發射器包括至少一雷射二極

體；該光電二極體具有一介於40度至80度之光接收角，該雷射二極體具有一介於15度至45度之光發射角；該干擾雷射光與該入射雷射光之發射訊號頻率相同，該干擾雷射光與該入射雷射光之波長介於850奈米至910奈米之間，該發射訊號頻率介於100赫茲至600赫茲之間；該干擾脈波之振幅大於該入射脈波之振幅；各該干擾脈波持續至重疊於其中一該入射脈波之3/4以上；該複數入射脈波之數量至少為3個，該干擾雷射光相對地於其前三個入射脈波之後發射；於該光接收器之前方另設有一濾波透鏡，該濾波透鏡為塑材且僅允許700奈米至900奈米波長的光通過，該光接收器及該光發射器連接於一電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收器；該金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電路，該濾波透鏡設於一外殼，該光接收器及該光發射器設於該外殼中。

11.請求項11：如請求項2所述的雷射干擾器，其中該處理單元包括一與該光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級放大器通聯之第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理器，該處理器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號間隔時間、且驅動該光發射器產生該干擾雷射光。

12.請求項12：如請求項3所述的雷射干擾器，其中該處理單元包括一與該光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級放大器通聯之第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理器，該處理器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號間隔時間、且驅動該光發射器產生該干擾雷射光。

13.請求項13：如請求項4所述的雷射干擾器，其中該處理單元包括一與該光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級放大器通聯之第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理器，該處理器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器

01 處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號
02 間隔時間、且驅動該光發射器產生該干擾雷射光。

03 三、爭點所示舉發證據：

04 (一)甲證1（舉發證據4）係西元1998年8月11日公告之美國第579
05 3477號「使雷射測速器失效之系統」專利案（圖式如附件二
06 所示）。

07 (二)甲證2（舉發證據2）係西元2003年11月6日公開之美國第200
08 3/0206286A1號「雷射轉發器」專利案（圖式如附件三所
09 示）。

10 (三)甲證4（舉發證據3）係西元2014年8月28日公開之美國第201
11 4/0240161A1號「脈波轉發器反制裝置」專利案（圖式如附
12 件四所示）。

13 (四)甲證6（舉發證據5）係西元1992年9月9日公告之中國大陸第
14 1018209B號「用激光來檢測和記錄違反道路交通規則的系
15 統」專利案（圖式如附件五所示）。

16 (五)前揭證據公告或公開日均早於系爭專利申請日（西元2017年
17 4月13日），可為系爭專利之相關先前技術。

18 四、爭點分析：

19 (一)系爭專利請求項1有關「複數干擾脈波……各持續至重疊於
20 其中一該入射脈波」技術特徵，應解釋為「各干擾脈波與各
21 入射脈波在時域上至少部分重疊」，且該入射脈波包含「反
22 射之入射脈波」（即反射脈波），並未排除二者完全重疊之
23 情形：

24 1.關於系爭專利請求項1界定之「複數干擾脈波……各持續至
25 重疊於其中一該入射脈波」技術特徵，原告主張其與說明書
26 第[0011]段內容所載相左，且對通常知識者而言，並無雷射
27 光「重疊」或「持續至重疊」等概念（卷一第18頁）；被告
28 原稱由系爭專利說明書前述內容及請求項1記載，可知請求
29 項1已限定為「脈波部分重疊」，並排除「脈波完全重疊」
30 的情況，嗣認亦可包含「完全重疊」之情況（卷一第301至3
31 02頁、第551頁）。

01 2.由系爭專利請求項1記載之「該複數干擾脈波間斷地各於該
02 複數入射脈波之間隔時間內發射、且各持續至重疊於其中一
03 該入射脈波」內容，特別是「間隔時間」與「各持續至重
04 疊」等語詞與上下文，可知前述內容旨在描述干擾脈波與入
05 射脈波在時域（時間）上的關係，所屬技術領域中具有通常
06 知識者即會將前述文義理解為：複數個干擾脈波出現於複數
07 個入射脈波之間隔時間內，且各個干擾脈波所持續之時間
08 （即脈波寬度持續時間）係與各入射脈波相互重疊，並未排
09 除「完全重疊」之情形。

10 3.復參照系爭專利說明書第[0003]段（卷一第445頁）記載
11 「習知之雷射干擾器一般是在收到該偵測器之雷射光後，透
12 過連續發射一干擾雷射光來覆蓋『反射之雷射光』。然而此
13 類習知技術並未針對該偵測器之雷射光的波長、訊號發射頻
14 率、振幅等性質進一步分析比對，效果較差」，以及第[001
15 1]段（卷一第447頁）記載「該干擾雷射光21之發射訊號頻
16 率與該入射雷射光40之發射訊號頻率相同，確保同步干擾該
17 雷射偵測器接收『反射之入射雷射光』。該干擾脈波22之振
18 幅較佳大於該入射脈波41之振幅，以有效覆蓋該入射脈波4
19 1。各該干擾脈波22持續至重疊於其中一該入射脈波41之1/2
20 以上，較佳為重疊3/4以上、甚至『完全重疊』，以完全阻
21 斷、干擾該雷射偵測器接收『反射之入射雷射光』……」，
22 可知雷射干擾器之原理係使干擾脈波早於（或同時於）「反
23 射之入射雷射光」（即反射脈波）為測速槍所接收，藉此干
24 擾測速槍偵測到正確數值。系爭專利即藉由與入射脈波相同
25 頻率之干擾脈波，間斷地於各入射脈波間隔時間內發出，使
26 各干擾脈波至少部分重疊或覆蓋入射脈波（或反射脈波），
27 以達精確干擾之目的，而二者彼此相重疊的程度（另可參系
28 爭專利圖6，卷一第458頁），前述說明書內容明確記載可為
29 1/2、3/4，並包含「完全重疊」之情形，益見系爭專利請求
30 項1之「重疊」解釋上不能逕予排除「完全重疊」之情形。

01 4.據上，系爭專利請求項1有關「複數干擾脈波……各持續至
02 重疊於其中一該入射脈波」技術特徵，應解釋為「各干擾脈
03 波與各入射脈波在時域上至少部分重疊」，即各干擾脈波與
04 各入射脈波二者之脈波寬度持續時間至少部分相互重疊，且
05 該入射脈波包含「反射之入射脈波」（即反射脈波），並未
06 排除二者完全重疊之情形。

07 (二)甲證2或甲證4不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性：

08 1.甲證2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性：

09 (1)查甲證2圖1及說明書相對應內容（第[0026]至[0031]段，卷
10 一第179頁；中譯見卷一第189頁）揭露一種雷射轉發器
11 (1)，可發射干擾雷射信號至雷射測速器(7)，且該雷射轉發
12 器(1)具有光學接收器(2)、光學發射器(6)及微處理器(4)等
13 構件，即分別對應揭露系爭專利請求項1之雷射干擾器包括
14 「光接收器」、「光發射器」及「處理單元」等構件。其
15 中，甲證2說明書第[0029]段記載「雷射測速器7所發射之監
16 測雷射信號8由光學接收器2接收。該光學接收器將該監測雷
17 射信號傳送至監測信號轉換器3後，該監測信號轉換器便將
18 該信號轉換為電監測信號9，並將該電監測信號傳送至微處
19 理器4」，意即甲證2之光學接收器(2)接收來自於雷射測速
20 器(7)之入射雷射光（為特定頻率並包含有複數脈波，參甲
21 證2圖3或第[0048]段，卷一第190頁），並透過轉換器(3)將
22 之轉換為相對應電監測信號(9)，即對應揭露系爭專利請求
23 項1之「一光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷
24 射光並產生一與該複數入射脈波相關聯之入射光訊號」技術
25 特徵。甲證2說明書第[0031]段（卷一第189頁）記載「該微
26 處理器將該電監測信號處理為具有所選第二頻率之電干擾信
27 號10，並將此信號傳送至干擾信號轉換器5，該干擾信號轉
28 換器將該電干擾信號轉換為干擾雷射信號11後，便由光學發
29 射器6發射該干擾雷射信號至該雷射測速器」，另甲證2圖3
30 及說明書第[0049]段（卷一第190頁）記載「由二條虛線所
31 標示之時窗具有等於 Δt_1 之時段。該干擾信號中之脈波列必

01 須在此時窗所標示之時段內發射，以確保該雷射測速器能依
02 其自身之預期，在所述時段內偵測到並顯示所述脈波列，並
03 因而將所接收之脈波列解讀為其所發射之監測脈波列之反
04 射」，即對應揭露系爭專利請求項1之「一處理單元，依據
05 該入射光訊號計算該複數入射脈波之相鄰二者之間的間隔時
06 間、且驅動該光發射器產生一干擾雷射光，該干擾雷射光包
07 括複數干擾脈波，該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈
08 波之間隔時間內發射」技術特徵。

09 (2)據上，前述甲證2圖3等處所揭示技術內容與系爭專利請求項
10 1之差異僅在於「該複數干擾脈波……各持續至重疊於其中
11 一該入射脈波」技術特徵。另甲證2第[0050]段（卷一第190
12 頁）記載「在一有利實施例中，該干擾信號係以與該監測脈
13 波列同相之方式(in phase with)發射，以確保各干擾脈波
14 列皆可在預期之時段內被接收」，前述內容既揭露干擾信號
15 與監測脈波「同相/同相位」，即指二信號在時域上完全重
16 疊，業已揭露前述差異技術特徵。

17 (3)原告雖主張甲證2前述技術內容足以證明系爭專利請求項1不
18 具新穎性云云。惟新穎性之審查，應就申請專利之發明與單
19 一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全
20 部或部分技術內容的結合，亦不得以一份引證文件中之部分
21 技術內容的結合進行比對（參核准審定時專利審查基準第二
22 篇第三章第2.3.2節）。系爭專利請求項1之全部技術特徵，
23 固已為甲證2圖3及說明書第[0050]段等處所共同揭露，然觀
24 諸甲證2圖3顯示干擾脈波雖在監測脈波之間隔時間內發射，
25 但干擾脈波與監測脈波「並未」重疊；第[0050]段則記載
26 「在一有利實施例中……同相之方式……」，指干擾脈波與
27 監測脈波同步，二者在時域上「完全重疊」，與圖3明顯分
28 屬不同實施例或實施態樣，自不能擷取甲證2說明書第[005
29 0]段與圖3之內容相互結合後，據以認定系爭專利請求項1不
30 具新穎性，故甲證2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎
31 性。

01 2. 甲證4不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性：

02 (1) 查甲證4圖1及說明書第[0039]段（卷一第212頁，中譯見卷
03 一第226頁）揭露有一種反制轉發器(110)，包含有光學接收
04 器(140)用以接收量測裝置(100)所發射且由放大器(142)加
05 以放大為量測脈波（對應於系爭專利之「入射脈波」），以
06 及用以發射干擾信號至量測裝置(100)之光學發射器(145/15
07 0)，對應揭露系爭專利請求項1之「一種雷射干擾器，包
08 括：一光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射光
09 並產生一與該複數入射脈波相關聯之入射光訊號」與「一光
10 發射器」技術特徵；甲證4說明書第[0051]段（卷一第213
11 頁，中譯見卷一第227頁）記載「根據本發明之一實施例，
12 該反制轉發器可辨識並干擾量測信號之有限序列。有限序列
13 量測裝置具有一組固定之信號，該序列中各信號之維度可根
14 據一組預定之變化而改變。例如，信號維度可有(n)種變
15 化，而在完成第(n)種維度變化後，信號循環便會重複，並
16 從第1種變化開始……」，另依甲證4說明書第[0039]段（卷
17 一第212頁，中譯見卷一第226頁）記載「反制轉發器110包
18 含中央處理單元(CPU)或數位信號處理器(DSP)155，且該CPU
19 或DSP係連接至多個周邊元件……」、第[0041]段（卷一第2
20 13頁，中譯見卷一第227頁）記載「……該反制轉發器可根
21 據一量測裝置之信號特徵辨識該量測裝置，並在預期之時窗
22 內發射干擾信號……」及圖3等相關內容，可知甲證4之反制
23 轉發器係以中央處理單元(155)來計算入射脈波之間隔時
24 間，並驅動光學發射器(145/150)產生干擾信號，對應揭露
25 系爭專利請求項1之「一處理單元，依據該入射光訊號計算
26 該複數入射脈波之相鄰二者之間的間隔時間、且驅動該光發
27 射器產生一干擾雷射光，該干擾雷射光包括複數干擾脈
28 波」、「該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間隔
29 時間內發射」技術特徵。

30 (2) 另甲證4說明書第[0057]段（卷一第214頁，中譯見卷一第22
31 8頁）記載「根據本發明之實施例，該反制轉發器可辨識並

01 干擾經程式化後可辨識及忽略形狀與回射信號之預期形狀不
02 同之干擾信號之量測裝置……例如，該反制裝置發送所謂誘
03 餌信號，例如一矩形信號，其目的係令反射信號與遮蔽信號
04 重疊(overlap)，並因而呈現矩形。該量測裝置會將該反射
05 信號視為假信號而加以忽略……」內容，可知甲證4揭露將
06 干擾脈波與反射脈波（即反射之入射脈波）相互重疊，使得
07 量測裝置（即測速槍）無法正確量測，對應揭露系爭專利請
08 求項1之「該複數干擾脈波……各持續至重疊於其中一該入
09 射脈波」技術特徵。

10 (3)據上，系爭專利請求項1之全部技術特徵固然已見於甲證4前
11 述內容，惟甲證4第[0057]段記載遮蔽信號與反射信號相互
12 重疊，與甲證4圖3及其相對應段落揭露干擾脈波(2B)未與反
13 射脈波(2')重疊，顯然分屬不同實施例，不能將之相互結
14 合後據以認定系爭專利請求項1不具新穎性，故甲證4不足以
15 證明系爭專利請求項1不具新穎性。

16 (三)甲證2及4之組合足以證明系爭專利請求項1、6不具進步性：

17 1.系爭專利請求項1分別與甲證2、4比對，甲證2、4各已揭露
18 系爭專利請求項1之全部技術特徵，俱如前述。甲證2、4之
19 技術內容均為雷射干擾器，屬相同技術領域；且二者均以有
20 效干擾測速器為其所欲解決之問題或目的；又二者所採取之
21 技術手段，均為偵測測速器之入射脈波後，由處理器驅動光
22 發射器發出干擾脈波，使測速器無法正確判別車輛速度，是
23 就光接收器、處理器及光發射器等相同硬體構件，及其產生
24 干擾脈波之功能、作用等具有共通性。甲證2第[0050]段教
25 示或建議「該干擾信號係以與該監測脈波列同相之方式(in
26 phase with)發射，以確保各干擾脈波列皆可在預期之時段
27 內被接收」；甲證4說明書第[0057]段亦教示將「反射信號
28 與遮蔽信號重疊(overlap)」，使量測裝置會將反射信號視
29 為假信號而加以忽略（另參甲證4第[0058]至[0060]段等，
30 卷一第228頁）；是以，所屬技術領域中具有通常知識者為
31 使測速器無法正確量測車輛速度，當有合理動機組合甲證

01 2、4所教示或建議之技術內容，使干擾信號與反射信號（經
02 反射之入射信號）在時域上相互重疊，進而輕易完成系爭專
03 利請求項1之發明；況且甲證2、4之不同實施例，各已共同
04 揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，俱如前述，則對所
05 屬技術領域中具有通常知識者而言，將同一先前技術中不同
06 實施例之內容相互組合，亦屬顯而易見。故甲證2、4之組合
07 足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

08 2.參加人主張系爭專利請求項1界定「干擾脈波間斷地於入射
09 脈波之間隔時間內發射」之技術特徵，而甲證2、4既揭露脈
10 波完全重疊，不會如系爭專利有干擾脈波提前於入射脈波發
11 射至「部分重疊」的現象云云（卷一第321至322頁）。惟如
12 前述，甲證2圖3及說明書第[0049]段，與甲證4第[0041]段
13 等，均揭露「干擾脈波間斷地於入射脈波之間隔時間內發
14 射」技術特徵；又如前述技術特徵之解釋，干擾脈波至少部
15 分重疊之「入射脈波」，包含「反射之入射脈波」（即反射
16 脈波）；意即在「干擾脈波間斷地於入射脈波之間隔時間內
17 發射」前提下，干擾脈波在時域上至少部分重疊（甚或完全
18 重疊）於反射脈波，二者並無衝突。復依甲證2第[0050]段
19 及甲證4第[0057]段等內容，均揭示將干擾脈波與「反射脈
20 波」完全重疊，以使量測裝置無法正確量測速度，可見不論
21 干擾脈波之發射時間是否間隔於入射脈波，重點仍在於干擾
22 脈波需提前或重疊於「反射脈波」（系爭專利說明書第[001
23 1]段亦如是說明）到達雷射偵測器，方能達成有效干擾之目
24 的。是既甲證2、4均已教示相關技術手段，且所屬技術領域
25 中具有通常知識者有動機結合甲證2、4及其不同實施例，即
26 足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

27 3.系爭專利請求項6係依附於請求項1，其所界定之附屬技術特
28 徵如前所述。查甲證4說明書第[0039]段（卷一第226頁）記
29 載「反制轉發器110包含中央處理單元（CPU）或數位信號處
30 理器（DSP）155，且該CPU或DSP係連接至多個周邊元件，包
31 含：可視需要而設置之放大器142……；用以接收量測裝置1

00所發射且已由放大器142加以放大之量測脈波之光學接收器140……；及至少一個用以發射干擾信號至量測裝置100之光學發射器或轉發器（145, 150）……。各發射器（145, 150）可視需要而包含發散透鏡147，藉以加大該干擾信號命中目標量測裝置（其位置未知）之機率」（另參甲證4圖1），甲證4前述中央處理單元(155)，以及與中央處理單元(155)相連接之光學接收器(140)、放大器(142)、光學發射器(150)，即分別對應揭露前述附屬技術特徵之處理器、光接收器、第一/第二級放大器、光發射器，是以前述附屬技術特徵已為甲證4所揭露。又甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，俱如前述，是以甲證2、4之組合亦足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

(四)甲證2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項2至5、11至13不具進步性：

1.系爭專利請求項2係依附於請求項1，其所界定之附屬技術特徵如前所述。查甲證4第[0099]段（卷一第230頁）記載「該反制轉發器將針對其所接收之每個脈波發送兩個脈波以為回應：第一脈波具有與所接收之脈波相同之振幅，且反映出吾人希望被量測到之假想速度，第二脈波則具有相對較大之振幅，且將由該量測裝置於其所預期之反射脈波抵達時間點接收，因而有效遮蔽該反射信號」即揭露以振幅較入射脈波為大之第二脈波作為干擾脈波；又以金屬罩進行電磁屏蔽以避免干擾，乃係電子或通訊技術領域之一般通常知識，甲證6圖1亦揭露一種雷射發射器與接收器，甲證6說明書第9頁第7至10行（卷一第251頁）記載「……光敏二極管(5)和與其相連接的前置放大器(7)都裝在鐵或其它能起電磁屏蔽的屏蔽罩(9)內，保護接收器免受激光器電源及其它外部所產生的干擾……」，即已揭露利用金屬屏蔽罩(9)來保護接收器，對應於前述附屬技術特徵有關金屬罩之技術特徵。甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述；甲證6所揭示之技術內容係關於雷射測速器，與甲證2、4均

01 為相同技術領域，且以雷射發射器、接收器與電信號間的轉
02 換進行速度量測或反制，於功能或作用上具有共通性，甲證
03 6既教示金屬屏蔽罩可保護接收器避免受外部干擾，則所屬
04 技術領域中具有通常知識者基於甲證2、4之技術內容，為避
05 免受電磁干擾，當有合理動機組合甲證6之金屬屏蔽罩，進
06 而輕易完成系爭專利請求項2所界定之發明。故甲證2、4及6
07 之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

08 2.系爭專利請求項3係請求項1之附屬項，其所界定之附屬技術
09 特徵如前所述。查甲證2第[0050]段揭露干擾信號與監測脈
10 波係「同相」，即指兩信號「完全重疊」而為「重疊1/2以
11 上」；另甲證4圖1（卷一第206、220頁）已揭露光學接收器
12 (140)、中央處理單元(155)等電子元件，則將電子元件藉由
13 電路板相互連接實屬必然。甲證6說明書第9頁第7至10行
14 （卷一第251頁）記載「……光敏二極管(5)和與其相連接的
15 前置放大器(7)都裝在鐵或其它能起電磁屏蔽的屏蔽罩(9)
16 內」，已揭露利用金屬屏蔽罩(9)來保護接收器。是以，系
17 爭專利請求項3之前述附屬技術特徵，已為甲證2、4、6所揭
18 露。甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步
19 性，已如前述。對所屬技術領域中具有通常知識者而言，其
20 基於甲證2、4所揭露之技術內容，為避免光接收器受電磁干
21 擾，當有合理動機組合甲證6之金屬屏蔽罩，進而輕易完成
22 系爭專利請求項3所界定之發明。故甲證2、4及6之組合足以
23 證明系爭專利請求項3不具進步性。

24 3.系爭專利請求項4係請求項1之附屬項，其所界定之附屬技術
25 特徵如前所述。查甲證2第[0050]段揭露干擾信號與監測脈
26 波係「同相」，即指兩信號之頻率相同；另甲證6圖1及說明
27 書第9頁第7至10行揭示利用屏蔽罩(9)來遮蔽接收器，避免
28 受電磁干擾，如金屬罩（屏蔽罩(9)）內之電子元件欲與外
29 部其他元件相連，或為便於接收外部信號，勢必需於金屬罩
30 開孔（即前述附屬技術特徵之「跨隙」），如甲證6之光敏
31 二極管(5)即需藉由屏蔽罩(9)之孔洞始能接收光線（參甲證

6圖1，卷一第257頁），是以前述附屬技術特徵已為甲證2、6所揭露。甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，業如前述。因甲證2、4、6均屬相同技術領域，就功能、作用等亦具共通性（詳如前述請求項2、3之理由），且甲證6教示金屬屏蔽罩可保護接收器避免受外部電磁干擾，則所屬技術領域中具有通常知識者基於甲證2、4之技術內容，為避免受電磁干擾時，當有合理動機組合甲證6之金屬屏蔽罩，進而輕易完成系爭專利請求項4所界定之發明。故甲證2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

4.系爭專利請求項5係依附於請求項1，其所界定之附屬技術特徵如前所述。查甲證2第[0061]段（卷一第190頁）記載「……該程式將進行控制，以判定其是否已在給定的時段內偵測到三個脈波列……」，甲證4第[0051]段（卷一第227頁）記載「根據本發明之一實施例，該反制轉發器可辨識並干擾量測信號之有限序列。有限序列量測裝置具有一組固定之信號，該序列中各信號之維度可根據一組預定之變化而改變。例如，信號維度可有(n)種變化，而在完成第(n)種維度變化後，信號循環便會重複，並從第1種變化開始……」，即揭露量測裝置所發出之入射脈波係有限序列而有多種可能；另甲證6圖1顯示前置放大器(7)等電子元件為屏蔽罩(9)（相當於系爭專利之金屬罩）所遮蔽，並另有聚焦鏡片(18)、鏡頭(3)設於外殼(1)中，當金屬罩（屏蔽罩(9)）內之電子元件欲與外部其他元件相連或為接收信號之必要，勢必需於金屬罩開孔（即前述附屬技術特徵之「跨隙」），如甲證6之光敏二極管(5)需藉由屏蔽罩(9)之孔洞始能接收光線，是以前述附屬技術特徵已為甲證2、4、6所揭露。又甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，及甲證2、4、6間具有組合動機，俱如前述，則甲證2、4及6之組合亦足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

5.系爭專利請求項11至13，係分別依附於請求項2至4，並均界定「其中該處理單元包括一與該光接收器通聯之第一級放大

器、一與該第一級放大器通聯之第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理器，該處理器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號間隔時間、且驅動該光發射器產生該干擾雷射光」之附屬技術特徵。查甲證4說明書第[0039]段（卷一第226頁）記載「反制轉發器110包含中央處理單元（CPU）或數位信號處理器（DSP）155，且該CPU或DSP係連接至多個周邊元件，包含：可視需要而設置之放大器142……；用以接收量測裝置100所發射且已由放大器142加以放大之量測脈波之光學接收器140……；及至少一個用以發射干擾信號至量測裝置100之光學發射器或轉發器（145, 150）……各發射器（145, 150）可視需要而包含發散透鏡147，藉以加大該干擾信號命中目標量測裝置（其位置未知）之機率」（另參甲證4圖1），甲證4前述中央處理單元（155），以及與中央處理單元（155）相連接之光學接收器（140）、放大器（142）、光學發射器（150），即分別對應揭露前述附屬技術特徵之處理器、光接收器、第一/第二級放大器、光發射器，是以前述請求項11至13之附屬技術特徵已為甲證4所揭露。甲證2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項2至4不具進步性，俱如前述，是以甲證2、4及6之組合亦足以證明系爭專利請求項11至13不具進步性。

(五)甲證1、2及4之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性：

- 1.系爭專利請求項7係依附於請求項6，其所界定之附屬技術特徵如前所述。甲證4之放大器（142）對應於系爭專利之第一/第二級放大器，以及甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性之理由，俱如前述。
- 2.查甲證2圖2（卷一第185頁）揭露雷射轉發器之電路（21），甲證2第[0032]段（卷一第189頁）記載「該電路包含五個次電路：IR光電二極體偵測器電路22……」，第[0033]段記載「該IR光電二極體偵測器電路之較佳者包含二個配置於典型電晶體放大器構型28……」。該放大器具有高增益(>50dB)，

且可放大來自該二個光電二極體且連接ac之電監測信號」，可見甲證2已揭露有二個電晶體放大器；甲證2第[0056]段（卷一第190頁）另記載「為提升該程式之效能、避免處理非必要之資料，同時提高該雷射轉發器之有效性，該電偵測信號將與多個閾值44進行比對，該等閾值係一組界定程式邊界以辨別所接收之信號是否為真正監測信號之數值」，前述甲證2之「閾值」即相當於前述附屬技術特徵之比較器設有閾值，僅允許電偵測信號符合一定臨界值始可通過，是以前述附屬技術特徵已為甲證2所揭露。

3. 甲證1所揭露之技術內容為雷射偵測器與雷射干擾器，與甲證2、4均相同技術領域，並均以雷射發射器、接收器與電信號間的轉換進行速度量測或反制，於功能或作用上具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者應有動機組合甲證1、2及4之技術內容；甲證1第15欄第1段（卷一第142頁，中譯見卷一第167頁末段至第168頁第1段）記載「該高頻放大器電路256具有30-50MHz之頻寬，……。放大電路256包括第一及第二放大器258及260，該兩者共同產生放大後之雷射偵測信號。第二放大器260包括連結至第一二極體整流器電路262之AGC輸入。因應接收到來自計時器電路264（圖9B）之信號，第一二極體整流器電路262觸發第二放大器260之AGC輸入，因而關閉第二放大器260，以免雜訊觸發干擾雷射光束」，即甲證1揭露有二個放大器，同樣對應於前述附屬技術特徵之第一/第二級放大器，又甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性，故甲證1、2及4之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

(六) 甲證1、2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項8至10不具進步性：

1. 系爭專利請求項8係依附於請求項7，其所界定之附屬技術特徵如前所述。查甲證2第[0057]段（卷一第190頁）記載「在圖示實施例中，該等閾值為脈波上升時間、光強度，但應瞭解，亦可增設許多其他閾值……」，可見甲證2已教示閾值

01 可為不同數值之設定，而既甲證2係將雷射光訊號轉換為電
02 訊號（參甲證2圖1），則將閾值設定為電訊號之電壓、電流
03 或振幅，僅為該技術領域通常知識者所能輕易設定者；另甲
04 證6圖1及說明書第9頁第6至10行揭示利用金屬屏蔽罩(9)來
05 遮蔽接收器，避免受電磁干擾，而金屬罩（屏蔽罩(9)）內
06 之電子元件欲與外部其他元件相連或便於接收外部信號，勢
07 必需於金屬罩開孔（即前述附屬技術特徵之「跨隙」），如
08 甲證6之光敏二極管(5)即需藉由屏蔽罩(9)之孔洞始能接收
09 光線（參甲證6圖1），是以前述附屬技術特徵係該技術領域
10 通常知識者依甲證2、6之技術內容所能簡單變更者；又甲證
11 1、2及4之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性，以及
12 甲證1、2及4，或甲證2、4及6間均具有組合動機俱如前述，
13 是以甲證1、2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項8不具
14 進步性。

15 2.系爭專利請求項9係依附於請求項1，其所界定之附屬技術特
16 徵如前所述。查甲證1第8欄第54至67行（卷一第138頁，中
17 譯見卷一第164頁倒數第2段）記載「……此雷射轉發器28包
18 括可接收入射雷射光束之光電二極體56……光電二極體56為
19 矽光電二極體，例如Siemens所製造之SFH 203 FA。該Sieme
20 ns光電二極體包括濾波範圍為200nm之光譜濾器，其中該濾
21 波範圍係以900nm波長為中心……該Siemens光電二極體之內
22 建透鏡31（圖4）具有相對偏小之光學受光角（例如20°），
23 以便將雷射偵測器30所接收之監測雷射光束信號最大化」，
24 是以甲證1已揭露雷射偵測器(30)（對應系爭專利之光接收
25 器）前方設有透鏡(31)（參甲證1圖4），且其允許波長900
26 奈米的雷射光通過，對應於前述附屬技術特徵有關「於該光
27 接收器之前方另設有一濾波透鏡，該濾波透鏡僅允許700奈
28 米至950奈米波長的光通過」部分；至於將濾波透鏡與光接
29 收器、光發射器等構件設於外殼中，僅係以外殼保護或封裝
30 電子電路構件之一般通常知識，如甲證6圖1即揭示以外殼
31 (1)包覆聚焦鏡片(18)，以及光敏二極管(5)、激光發射器(1

01 0)等構件（即光接收器、光發射器），即對應於前述附屬技
02 術特徵有關「該濾波透鏡設於一外殼，該光接收器及該光發
03 射器設於該外殼中」部分。即甲證1、6業已揭露系爭專利請
04 求項9之前述附屬技術特徵。甲證2、4之組合足以證明系爭
05 專利請求項1不具進步性，其理由俱如前述，又甲證1、6之
06 技術內容為雷射偵測器或雷射干擾器，與甲證2、4屬相同技
07 術領域，並均以雷射發射器、接收器與電信號間的轉換進行
08 速度量測或反制，於功能或作用上具有共通性，則所屬技術
09 領域中具有通常知識者當有動機組合甲證1、2、4及6，進而
10 輕易完成系爭專利請求項9之發明，故甲證1、2、4及6之組
11 合足以證明系爭專利請求項9不具進步性。

12 3.系爭專利請求項10係依附於請求項8，其所界定之附屬技術
13 特徵如前所述。查甲證1第8欄第64至67行（卷一第138頁，
14 中譯參卷一第164頁）記載「光電二極體之內建透鏡31（圖
15 4）具有相對偏小之光學受光角（例如 20° ），以便將雷射偵
16 測器30所接收之監測雷射光束信號最大化」，即相當於前述
17 附屬技術特徵之光電二極體之光接收角。甲證2第[0050]段
18 （卷一第190頁）已揭示干擾信號與監測脈波同相，即指干
19 擾脈波與入射脈波頻率相同且完全重疊；甲證2第[0027]段
20 （卷一第189頁）記載「在一個實施例中，光發射器6是典型
21 904-905nm波長的雷射二極體，而在另一實施例中則係一通
22 常具有870nm波長之IR二極體」；甲證2第[0055]段（卷一第
23 190頁）記載「……帶通濾波器的頻帶係設定為70Hz至700H
24 z，使得100Hz至600Hz的頻率（例如已知雷射測速設備之工
25 作頻率）得以通過」；甲證4第[0039]段（卷一第226頁）記
26 載「……光學接收器140……具有寬廣之波長範圍（例如400
27 -1100nm），又例如SiAPD，其波長範圍為880-930nm」，前
28 述甲證2、4之技術內容即已揭露前述附屬技術特徵有關「該
29 干擾雷射光與該入射雷射光之發射訊號頻率相同，該干擾雷
30 射光與該入射雷射光之波長介於850奈米至910奈米之間，該
31 發射訊號頻率介於100赫茲至600赫茲之間」、「各該干擾脈

波持續至重疊於其中一該入射脈波之3/4以上」部分。甲證4第[0058]段（卷一第228頁）記載「……該反制裝置亦發送參數略有不同（例如振幅較大）之所謂干擾信號」，或第[0099]段（卷一第230頁）記載以振幅較大的第二脈波作為干擾脈波，對應揭露前述技術特徵「該干擾脈波之振幅大於該入射脈波之振幅」部分。甲證2第[0061]段（卷一第190頁）記載「在步驟46中，該程式將進行控制，以判定其是否已在給定的時段內偵測到三個脈波列……」，之後於步驟50中進行干擾程序（參甲證2圖4或第[0071]段，卷一第191頁），即揭露前述附屬技術特徵有關「該複數入射脈波之數量至少為3個，該干擾雷射光相對地於其前三個入射脈波之後發射」部分。甲證1第8欄第54至67行（卷一第138頁，中譯見卷一第164頁倒數第2段）記載「……此雷射轉發器28包括可接收入射雷射光束之光電二極體56……光電二極體56為矽光電二極體，例如Siemens所製造之SFH 203 FA。該Siemens光電二極體包括濾波範圍為200nm之光譜濾器，其中該濾波範圍係以900nm波長為中心……該Siemens光電二極體之內建透鏡31（圖4）具有相對偏小之光學受光角（例如20°），以便將雷射偵測器30所接收之監測雷射光束信號最大化」，對應揭露前述附屬技術特徵「於該光接收器之前方另設有一濾波透鏡，該濾波透鏡為塑材且僅允許700奈米至900奈米波長的光通過」部分。甲證6圖1揭示聚焦鏡片(18)、鏡頭(3)設於外殼(1)中，甲證6說明書第9頁第7至10行（卷一第251頁）揭示利用金屬屏蔽罩(9)來遮蔽接收器，避免受電磁干擾，而金屬罩（屏蔽罩(9)）內之電子元件欲與外部其他元件相連或為便於接收外部信號，勢必需於金屬罩開孔（即前述附屬技術特徵之「跨隙」），如甲證6之光敏二極管(5)即需藉由屏蔽罩(9)之孔洞始能接收光線（參甲證6圖1），對應揭露前述附屬技術特徵「該光接收器及該光發射器連接於一電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收器；該金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電

01 路，該濾波透鏡設於一外殼，該光接收器及該光發射器設於
02 該外殼中」部分。既甲證1、2、4及6之組合足以證明系爭專
03 利請求項8不具進步性，俱如前述，且請求項10之附屬技術
04 特徵亦為甲證1、2、4及6所揭露，則甲證1、2、4及6之組合
05 亦足以證明系爭專利請求項10不具進步性。

06 柒、綜上所述，原告所提甲證2或甲證4雖不足以證明系爭專利請
07 求項1不具新穎性，然爭點所示證據組合足以證明系爭專利
08 請求項1至13不具進步性，系爭專利違反核准時專利法第22
09 條第2項規定，原處分關於系爭專利請求項1至13舉發不成立
10 之審定，即有違誤，訴願決定予以維持，亦有未洽，原告請
11 求撤銷訴願決定及原處分關於請求項1至13部分，並命被告
12 就系爭專利請求項1至13應作成舉發成立之審定，為有理
13 由，應予准許。

14 捌、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資
15 料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述的
16 必要。

17 玖、結論：原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第2條，
18 行政訴訟法第98條第1項前段、第218條，民事訴訟法第385
19 條第1項前段規定，判決如主文。

20 中 華 民 國 113 年 11 月 13 日

21 智慧財產第一庭

22 審判長法 官 汪漢卿

23 法 官 蔡惠如

24 法 官 陳端宜

25 以上正本係照原本作成。

26 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
27 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
28 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提
29 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
30 他造人數附繕本）。

01 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，
02 逕以裁定駁回。

03 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟
04 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
05 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
06

得不委任律師 為訴訟代理人 之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

01 中 華 民 國 113 年 11 月 13 日
02 書記官 吳祉瑩